



中華民國專利證書

發明第 I 490542 號

發明名稱：掃描透鏡及應用該掃瞄透鏡之干涉量測裝置

專利權人：國立臺灣大學

發明人：蔡建中、黃升龍

專利權期間：自 2015 年 7 月 1 日至 2033 年 5 月 6 日止

上開發明業經專利權人依專利法之規定取得專利權

經濟部智慧財產局

局長

王美花

中華民國

104



月 1 日

注意：專利權人未依法繳納年費者，其專利權自原繳費期限屆滿後消滅。